



CDE ResMap 178

抵抗率測定装置

4 探針法・手動・卓上型

ResMap 178 は費用対効果の高い表面抵抗率測定器です。研究、プロセス開発、ツール特性判定のニーズを満たすだけでなく、そのニーズを上回る性能を目指して設計された 4 探針法抵抗率マッピングシステムです。正確性、再現性、信頼性を備えています。

Specifications			
ウエハ搬送方法	手動	エッジ除外 (最小)	1.5mm (プローブ中心から基板端まで)
ウエハサイズ	2~8インチ (手動)	コンピューターシステム	Computer CPU 3.2GHz I3, 4GB memory, 1TB hard drive, operating system: Windows XP
最大径	8.2インチ(208mm)	SECS-II オプション	可能
標準測定時間	1点あたり1秒	マッピングパターン	円形マッピング (ノッチ/フラットに合わせる或いはフラットに沿う)、長方形マッピング、ラインスキャン (直径、半径、または直径に沿った任意の2点間、最小間隔0.1 mm)、ユーザーにて定義可能 (テンプレート)
標準ウエハ搬送時間	N/A	プロット	等高線 (間隔選択、1/3σ、固定および自動)、3D、直線、データマップ、ヒストグラム、データシーケンス、半径方向および角度方向分布、各種モードのトレンドチャートが使用可能
標準ノッチ検出時間	N/A	データ	ResMapのデータファイルはすべて分析用にエクセル等のプログラムへ書き込みが可能
最大スループット	1分(ウエハ、49点)	Facilities	
測定範囲	1 mΩ/sq- 10MΩ/sq (1 mΩ/sqに最適化可能)	工場側真空	不要
再現性	静止状態: ≤ ±0.02% 可動状態: ≤ ±0.1% (near by spots, typical)	電源	100V ~ 240V < 10 KVA
精度	≤ ±0.5% NIST規格による	寸法(幅×奥行×高)	12"× 19"× 10" (304mm×482mm×254mm)

NTE

NAGASE Group

ナガセテクノエンジニアリング株式会社

Creative Design Engineering, Inc.
20565 Alves Drive, Cupertino, CA 95014 USA
Tel: +1-408-366-2626 Fax: +1-408-366-2882
www.CDE-ResMap.com

Rev. 150202